

05

Влияние двойниковой границы на теплоемкость и диффузное рассеяние кристаллом

© В.Н. Думачев

Воронежский институт МВД РФ, Воронеж

E-mail: dumv@comch.ru

Поступило в Редакцию 17 сентября 2004 г.

В рамках макроскопической динамической теории рассматривается влияние когерентных двойниковых границ на теплоемкость и диффузное рассеяние кристаллом.

Успехи современных нанотехнологий в синтезе структур произвольной размерности делают актуальной задачу изучения естественных низкоразмерных образований кристалла, таких как дислокации и доменные границы и их влияние на механические и кинетические свойства материалов. В настоящей работе показано существенное влияние когерентных двойниковых границ кристалла на его термодинамические свойства.

Рассмотрим упругий континуум с включенным в него дефектом — источником поля пластической деформации. Локальное изменение положения поверхности этого дефекта ведет к изменению величины несовместности вокруг него, которое в случае плоских дефектов проявляется как движение дислокаций несоответствия. Возникающие при этом конфигурационные или поверхностные силы пытаются привести границу дефекта к равновесному положению, а сама несовместность, вследствие инерционных свойств среды, становится источником излучения упругих волн. Учитывая, что полная деформация кристалла u_{lm} при наличии дефекта структуры складывается из упругой ε_{lm} и пластической s_{lm} части, лагранжиан упругого континуума имеет вид

$$L = \frac{1}{2} \int dr dt (\rho(\dot{u}_i)^2 - (u_{ik} - s_{ik})\lambda_{iklm}(u_{lm} - s_{lm})). \quad (1)$$

Будем рассматривать когерентную границу раздела как самостоятельный объект кристалла, который имеет собственную динамическую

переменную $\zeta(\mathbf{r}_{\parallel}, t)$ — прогиб границы относительно своего габитуса. Тогда, записывая пластическую деформацию, возникающую при прогибе границы в виде

$$s_{ij} = \zeta(\mathbf{r}_{\parallel}, t)\delta(z)[S_{ij}]$$

и подставляя ее в лагранжиан (1), после варьирования по динамическим переменным $u_i(\mathbf{r}, t)$ и $\zeta(\mathbf{r}_{\parallel}, t)$ получим систему дифференциальных уравнений [1]

$$\begin{aligned} \rho \ddot{u}_i - \lambda_{iklm} \partial_{kl}^2 u_m + \partial_k (\lambda_{ik}^s \delta(z) \zeta(\mathbf{r}_{\parallel}, t)) &= 0, \\ (\lambda_{ik}^s \partial_k u_m - \lambda^s \delta(z) \zeta(\mathbf{r}_{\parallel}, t))_{z=0} &= 0, \end{aligned}$$

условием самосогласованного решения которых является дисперсионное уравнение [2]

$$\frac{q_y^2 - \omega^2/c_t^2}{\sqrt{\mathbf{q}_{\parallel}^2 - \omega^2/c_t^2}} + \frac{4q_x^2}{\omega^2/c_t^2} \left(\sqrt{\mathbf{q}_{\parallel}^2 - \omega^2/c_t^2} - \sqrt{\mathbf{q}_{\parallel}^2 - \omega^2/c_t^2} \right) = 0. \quad (2)$$

Здесь предполагается, что габитусная плоскость границы перпендикулярна оси Oz , $[S_{ik}] = 1/2(n_i S_k + n_k S_i)$ — скачок тензора пластической деформации при переходе через границу, $n_i = (0, 0, 1)$ — вектор нормали, $S_i = (S_x, 0, 0)$ — вектор смещения границы, $\lambda^s = S_{ik} \lambda_{iklm} S_{lm} = S_{ik} \lambda_{ik}^s$. Корни дисперсионного уравнения (2) определяют соотношение между собственным волновым вектором \mathbf{q}_{\parallel} и собственной частотой ω изгибных колебаний границы [3]: $\omega = \xi(\varphi) c_t \mathbf{q}_{\parallel}$.

Рассчитаем фононную теплоемкость кристалла [4]. Приближение Эйнштейна для этой задачи предполагает использование линейной зависимости частоты волны ω от волнового вектора \mathbf{q} . Использование уравнения (2) позволяет учесть влияние нелинейной дисперсии, связанной с наличием в кристалле планарного дефекта. Так, для числа всех полевых осцилляторов с волновым числом, меньшим \mathbf{q} , имеем

$$N(\omega) = \int_0^q d\mathbf{q}_{\parallel} = \int_0^{\omega/c_t \xi(\varphi)} q dq d\varphi = \frac{\omega^2}{2c_t^2} \int_0^{\pi/2} \frac{d\varphi}{\xi^2(\varphi)} = \frac{\omega^2}{2c_t^2} \frac{\pi}{2} \Omega,$$

где $\Omega \cong 1.074$. Отсюда находим значение дебаевской частоты ω_0 для связанных фононных состояний

$$\omega_0^2 = \frac{4Nc_t^2}{\Omega\pi} = \frac{\omega_{\theta}^2}{3\Omega},$$

где ω_{θ} — дебаевская частота объемных волн. Такое значительное уменьшение частоты Дебая двойниковой границы связано со смягче-

нием фононных мод при смещении атомов решетки вдоль направления вектора сдвига S_i .

Использование спектрального распределения (2) позволяет найти среднюю энергию локализованных колебаний при низких температурах ($T \ll T_0$) в дебаевском приближении

$$\langle E_0 \rangle = \int_0^{\infty} \frac{\hbar\omega}{\exp(\hbar\omega/kT) - 1} dN(\omega) = \frac{\hbar}{c_l^2} \frac{\pi}{2} \Omega \omega_0^3 2\xi(3) = \frac{1}{\sqrt{3}\Omega} \langle E_\theta \rangle,$$

где $\xi(3) = 1.202057$ — дзета-функция Римана, $\langle E_\theta \rangle$ — средняя энергия объемных волн бездефектного кристалла.

Теплоемкость определяется формулой $c_v^0 = \partial E / \partial T$. Однако в нашем случае удобнее сразу найти ее отношение к теплоемкости бездефектного материала

$$\frac{c_v^0}{c_v^\theta} = \frac{\partial E_0 / \partial T}{\partial E_\theta / \partial T} = \frac{\partial E_0}{\partial E_\theta} = \frac{1}{\sqrt{3}\Omega} \quad \text{или} \quad c_v^0 = \frac{c_v^\theta}{\sqrt{3}\Omega}.$$

Очевидно, что такое уменьшение теплоемкости вызывается двумя факторами: во-первых, 3-кратным уменьшением количества объемных колебательных мод кристалла, из которых формируется поверхностный волновой пакет, а во-вторых — анизотропией скорости собственно поверхностного волнового пакета при распространении вдоль двойниковой границы.

Появление в кристалле единичной когерентной двойниковой границы не изменяет положения дифракционных максимумов электронного или рентгеновского рассеяния. Ансамбль параллельных двойников может привести лишь к возникновению сателлитов сверхструктуры. Однако изменение спектра колебаний кристалла вблизи двойниковой границы приводит к существенному уменьшению интегральной интенсивности бормановского рассеяния за счет увеличения диффузного рассеяния [5].

Представляя тепловые колебания атомов двойниковой границы как систему упругих стоячих волн, описываемых уравнением (2), учтем их влияние на интенсивность селективных максимумов через фактор Дебая–Уэллера

$$2M = \frac{16\pi^2 \langle u^2 \rangle}{3} \frac{\sin^2 \vartheta}{\lambda^2}.$$

Здесь среднеквадратичное смещение атомов кристалла можно выразить через уже полученное выражение для средней энергии

$$\langle u_0^2 \rangle = \int_0^\infty \frac{E_0}{\omega^2} dN(\omega) = \int_0^\infty \frac{\hbar}{\exp(\hbar\omega/kT) - 1} \frac{dN(\omega)}{\omega} = \sqrt{3\Omega} \langle u_0^2 \rangle.$$

Как и в предыдущем случае, наличие в кристалле когерентной двойниковой границы приводит к $\sqrt{3\Omega} \approx 1.8$ кратному изменению исследуемого эффекта.

Список литературы

- [1] Роцупкин А.М., Нечаев В.Н., Думачев В.Н. // Изв. РАН. Сер. Физ. 1995. Т. 59. В. 10. С. 108.
- [2] Нечаев В.Н., Роцупкин А.М. // ФТТ. 1989. Т. 31. В. 8. С. 77.
- [3] Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория упругости. М.: Наука, 1987. 248 с.
- [4] Терлецкий Я.П. Статистическая физика. М.: Высш. шк., 1994. 350 с.
- [5] Иверонова В.И., Ревкевич Г.П. Теория рассеяния рентгеновских лучей. М.: МГУ, 1978. 278 с.